

デュアルビューを同時に測定 最速 ICP-OES

The Measure of Confidence

Agilent 5100 ICP-OES



最速 ICP-OES

Agilent 5100 シンクロナス・パーティカル・デュアルビュー (SVDV) ICP-OES は、ICP-OES 分析に革命をもたらします。独自のダイクロイックスペクトルコンバイナ (DSC) 技術により、アキシャルビュー分析とラディアルビュー分析を同時に実行することが可能です。

時間短縮とコスト削減

- 超高速の ICP-OES 分析を実現することにより、1 サンプルあたりのガス消費を削減
- 1 回の分析で全ての波長を同時に測定することにより、優れた測定精度を実現
- 検出器へのパーティガスが不要な Vista Chip II 検出器を搭載することにより、ウォームアップ時間を短縮し、分析開始の迅速化を実現

比類のない性能

- 垂直配置トーチにより、きわめて分析困難なサンプルに対応
- ソリッドステート RF システムにより、長時間にわたる分析安定性を実現

シンプルな分析

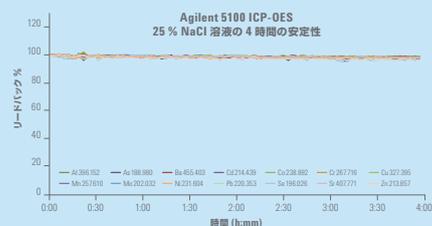
- 直観的な Agilent ICP Expert ソフトウェアと DSC 技術により、簡単にメソッドを作成可能
- パワフルなソフトウェアにより、メソッド開発の簡素化、精度の向上、測定範囲の拡大を実現

フレキシブルな構成

- Agilent 5100 は、3 機種から選択可能
- シンクロナス・パーティカル・デュアルビュー (SVDV)
- パーティカル・デュアルビュー (VDV)
- ラディアルビュー (RV)

堅牢性と安定性

すべての構成に共通する垂直配置トーチと堅牢なソリッドステート RF により、きわめて分析困難なサンプルにも簡単に対応できます。



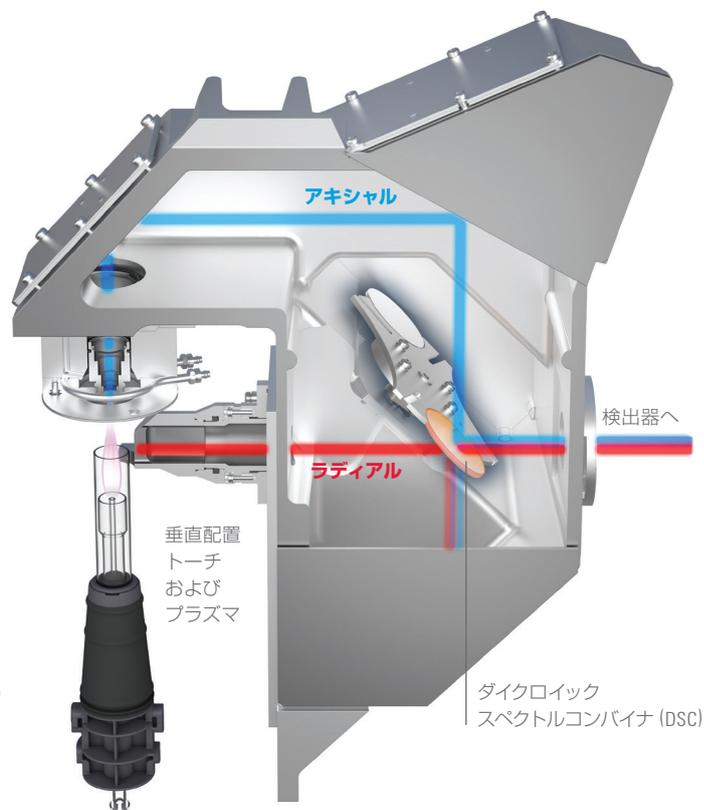
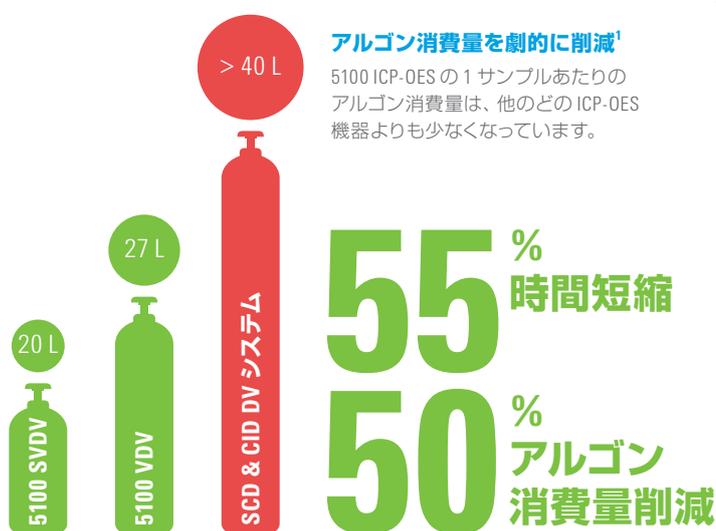
25% NaCl 溶液中にスパイクした多元素の安定性を示しています。4 時間以上にわたりすべての元素において、内標準補正なしで 1.3% を下回る RSD を実現しています。



Agilent Technologies

シンクロナスバーティカル デュアルビューの仕組み

5100 SVDV ICP-OESに必要な測定は、1 サンプルあたり 1 回だけです。ダイクロイックスペクトルコンバイナ (DSC) 技術により、プラズマのアキシャルビューとラディアルビューを 1 回で測定することが可能です。これにより、最短の時間で正確な分析結果を得られます¹。



ご存知でしたか？

従来のデュアルビュー ICP-OES システムでは、アキシャルモードで測定する元素とラディアルモードで測定する元素を選択し、一連のシーケンス測定を設定する必要があります。

また、各モードで 2 つのスリットを使って短波長と長波長を測定するシステムがあります。そのため、1 サンプルあたり最大 4 回のシーケンス測定が必要となります。

1. 分析スピードおよびガス消費量の数字は、公開されたアプリケーションデータをもとに、他社システムと比較したものです。詳細については、技術資料 5991-4821EN をご覧ください。

詳細情報：

www.agilent.com/chem/jp

カスタマコンタクトセンタ：

0120-477-111

email_japan@agilent.com

本資料記載の情報は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社

© Agilent Technologies, Inc. 2014

Published July 1, 2014

5991-4835JAJP

